

FRONT-END

MOS-FET

IGBT

DIODE

SEMICONDUCTOR TEST SYSTEM / INDUCTIVE LOAD TESTER 半導体テストシステム / L 負荷テスター

CHT2060ZA/SLV560ZA

2400V
600A

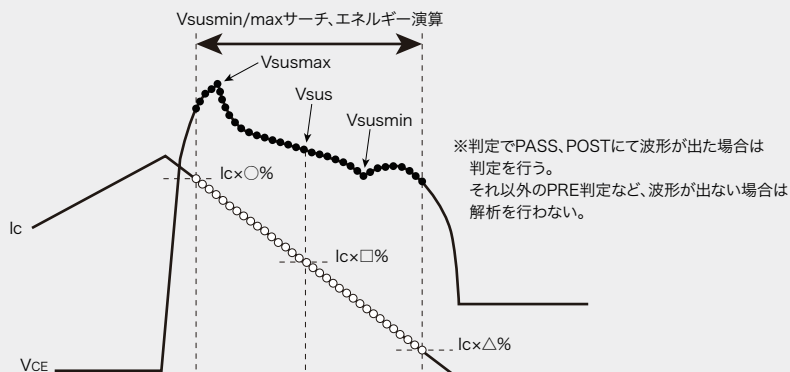
- This system provides DC and L load measurements in succession using a measuring section with an overhead mechanism taking into account the prober measurement. In case of abnormal waveform detection in L load measurements, a protection circuit in the Head Box is equipped with a fast power cut-off function.

- 本器はプローバー測定を考慮したオーバーヘッド機構の測定部により、DC 測定と L 負荷測定を連続して行えるテストシステムです。L 負荷測定での異常波形検出はヘッドボックス内の保護回路より、高速で電源を遮断する機能が装備されています。



■ L 負荷測定波形解析

- ① L 負荷測定時、オシロスコープの波形を取り込みデータ解析を行い合否判定を行う。
- ② 合否判定をオシロスコープで行うか、行わないかはテストプログラムで選択可能。
- ③ オシロスコープの設定はテストプログラムで行い、JOIN 時に設定データを転送する。
- ④ 指定したカテゴリー No. の波形を任意のフォルダに保存。ファイル形式は TIF、CSV(Ch 毎)。どちらかの形式または両方を選択可能とする。
- ⑤ データとして取り込む項目(アイテム名は任意)
 - ・ Vsus, Vsusmin, Vsusmax, Ic (Id, If), 演算によるエネルギー
 - ・ Vsus 測定ポイント(デフォルト値 50%)
 - ・ Vsusmin, Vsusmax, Ic (Id, If), エネルギー(任意設定)



■エネルギー: Icで設定した範囲のIc(A)×Vce(V)×時間幅(s)の総和

MODEL		CHT2060ZA/SLV560ZA	
SOFTWARE			
TEST PLAN/SORT PLAN		1000/1000	
BIN OUT		24	
DC TEST			
MEASURABLE DEVICES	MOS-FET, IGBT, DIODE		
VOLTAGE/CURRENT	2400V/600A		
TEST ITEMS	MOS-FET	IDS, IDG, ICEx(IE), IGsX, IGs, BVDS, BVDG, BVSG, BVGS, BVSDS, VFGD, VFGS, VFSDS, VP, VGsTH, VTH, VGsOFF, VDsON, RdsON, Vds(SAT), IDON, DHIDSS, GMP, GMV, GMI, GMP DGS, IGON, RG	
	IGBT	ICE, ICG, IGES, BVCE, BVCG, BVEG, BVECO, VFEC, VGETH, VTH, VGEOFF, VCE(SAT), VCEON, ICON, GMP, GMP DGS, Thlck	
	DIODE	IR, VR, VF, IF, ThIR, ThVR, ThVZ, ThVF, ThIf	
	ZENNER DIODE	IZ, VZ, VF	
INDUCTIVE LOAD TEST			
MEASURABLE DEVICES	MOS-FET, IGBT, DIODE		
SETTING RANGE	VDD	1V~500V	
	VGF	0V~±39.9V	
	VGR	0V~±39.9V	
	V-GATE	0V~2000V	
	ID/IL	2.0A~600A	
	LG/UG(ID)	2.0A~600A	
	ON TIME	0.0010ms~1.0000ms	
	DETECT DELAY	0.1 μs~9.9 μs	
	Rg SELECT	6 STEP SELECT	
DIMENSIONS & WEIGHT			
MAIN UNIT	1200(W)×1450(D)×2020(H)…800kg		